

目 次

第Ⅸ部 審査の進め方

第1節 概論

1. 審査の基本方針	1
2. 審査手順の概要	1

第2節 各論

1. 本願発明の理解	1
2. 先行技術調査	1
2.1 調査対象	1
2.2 調査の手順	2
2.3 調査結果の記録	3
3. 先行技術文献等の検討	3
4. 拒絶理由通知	4
4.1 拒絶理由通知の種類	4
4.2 拒絶理由通知を行う際の留意事項	5
4.3 具体的運用	6
4.3.1 一回目の拒絶理由通知	6
4.3.2 一回目の拒絶理由通知に対する意見書・補正書等の検討	7
4.3.3 二回目以降の拒絶理由通知	7
4.3.3.1 「最後の拒絶理由通知」とすべき場合	7
4.3.3.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合	8
4.3.3.3 「最後の拒絶理由通知」における留意事項	9
4.4 出願人との意思疎通の確保	9
5. 審査のために必要な書類その他の物件の提出の求め	10
5.1 提出を求めることができる書類等	10
5.2 留意事項	10
6. 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査	11
6.1 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかの検討	11
6.2 補正の検討	11
6.2.1 却下の対象となる補正	11
6.2.2 補正の適否の検討手順	13
6.2.3 独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項	13
6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い	14
6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い	14
7. 査定	15
7.1 特許査定	15
7.2 拒絶査定	15
8. 前置審査	15
8.1 前置審査の手順	16
8.2 留意事項	17
(別添)外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン	18